

# ANALITSKA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA

Vrstični elektronski mikroskop (scanning electron microscope) – SEM:

- velike povečave → **morfologija** vzorca

Transmisijski elektronski mikroskop – TEM:

- $V \approx 1\text{nm}^3$  vzorca → **struktura** in kristalografski podatki o vzorcu
- 



Analitska elektronska mikroskopija – AEM na vrstičnem transmisijskem elektronskem mikroskopu - STEM :

- morfologija vzorca
- kvalitativna in kvantitativna kemična sestava (nano področje)
- struktura vzorca

## Značilnosti AEM:

- visoka energija vpadnih elektronov
  - elastično sipani elektroni
    - slika površine
    - uklonska slika
  - neelastično sipani elektroni – kemijska sestava